

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)(51) Internationale Patentklassifikation⁶ :

G07D 7/12, 7/02

A3

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/49655

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

5. November 1998 (05.11.98)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/01182

(22) Internationales Anmeldedatum: 24. April 1998 (24.04.98)

(30) Prioritätsdaten:
197 18 916.4 25. April 1997 (25.04.97) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): WHD
ELEKTRONISCHE PRÜFTECHNIK GMBH [DE/DE]; In-
dustriestrasse 19, D-01129 Dresden (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PUTTKAMMER, Frank
[DE/DE]; Kastanienstrasse 19, D-01640 Coswig (DE).(74) Anwalt: HEITSCH, Wolfgang; Göhlsdorfer Strasse 25g,
D-14778 Jeserig (DE).(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB,
GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,
SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW,
ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES,
FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

Veröffentlicht

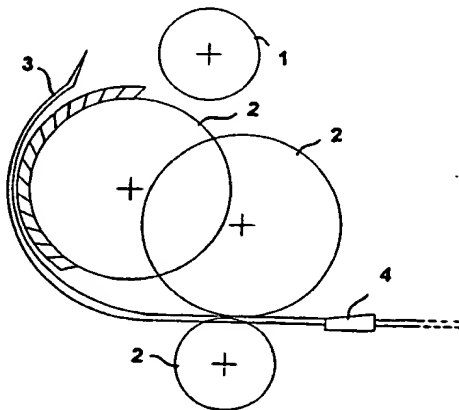
Mit internationalem Recherchenbericht.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchen-
richts:

4. Februar 1999 (04.02.99)

(54) Title: APPLICATION AND METHOD FOR CHECKING DOCUMENTS WITH EFFECTIVE OPTICAL DIFFRACTION SECURITY LAYER

(54) Bezeichnung: ANWENDUNG UND VERFAHREN ZUR PRÜFUNG VON DOKUMENTEN MIT BEUGUNGSOPTISCH WIRKSAMEN SICHERHEITSSCHICHTEN



(57) Abstract

The invention relates to an application and a method for checking documents. Hitherto, documents with optical diffraction security layers, specially holograms, were checked by costly optical monitoring technology. The entire monitoring process was so time-consuming that the monitoring process could not be applied to fast operating processing machines. Rapid monitoring (as an authentication characteristic) constitutes a further security step in evaluating effective optical diffraction security layers. The effective optical diffraction layer has a discontinuous metallizing layer and/or partially metal layers and/or areas of metal layers on various planes. Several methods of measurement exist to detect electrical conductivity. In practice, the contactless capacitive method of measurement has proven to be more practical.